

High Current Power MOSFET

IXTH 48N15
IXTT 48N15

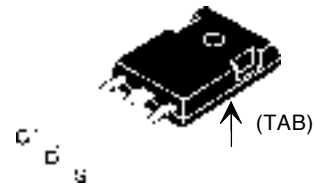
$V_{DSS} = 150 \text{ V}$
 $I_{D25} = 48 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} = 32 \text{ m}\Omega$

N-Channel Enhancement Mode

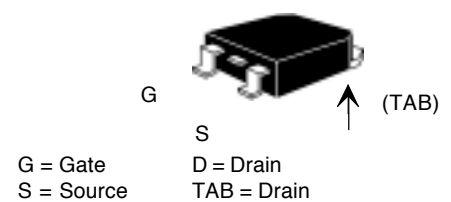


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	150	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	150	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	48	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	192	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	48	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.0	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	180	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247 AD	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXTH)



TO-268 (IXTT) Case Style



Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect

Advantages

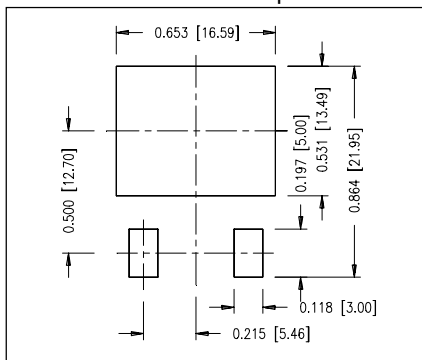
- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	150		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	2.0		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$			25 μA
	$T_J = 125^\circ\text{C}$			250 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			32 $\text{m}\Omega$

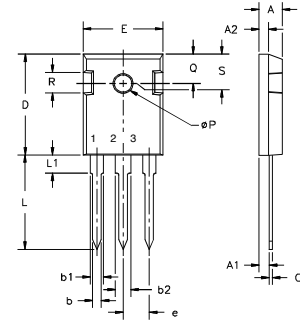
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 I_{D25}$, pulse test	20	35	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		3200	pF
C_{oss}			720	pF
C_{rss}			285	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$ $R_G = 2\ \Omega$ (External)		18	ns
t_r			20	ns
$t_{d(off)}$			68	ns
t_f			17	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		140	nC
Q_{gs}			35	nC
Q_{gd}			55	nC
R_{thJC}	(TO-247)		0.65	K/W
R_{thCK}				K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			48 A
I_{SM}	Repetitive			92 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
T_{rr}	$I_F = 25\text{ A}$ $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{ V}$		150	ns
Q_{RM}			2.0	μC

Min Recommended Footprint



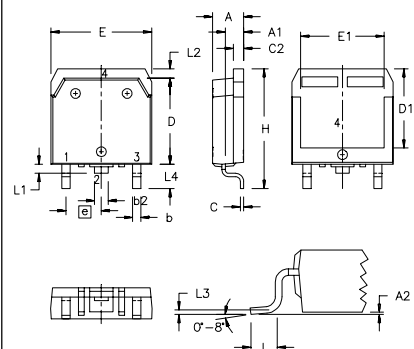
TO-247 AD Outline



Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source Tab - Drain

Dim.	Millimeter Min.	Millimeter Max.	Inches Min.	Inches Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A1	2.2	2.54	.087	.102
A2	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b1	1.65	2.13	.065	.084
b2	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15 BSC		.242 BSC	

TO-268 Outline



Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source Tab - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592 4,881,106 5,017,508
4,850,072 4,931,844 5,034,796

5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1
5,063,307 5,237,481 5,381,025



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.